

MAG-TD200

KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH W POLACH PRZEMIENNYCH I WIRUJĄCYCH



Komputerowy system pomiarowy MAG-TD200 przeznaczony jest do badania i wyznaczania dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich zarówno w polach przemiennych jak i wirujących.

W polach przemiennych badania wykonywane są w zakresie częstotliwości od 3 do 2 000 Hz, natomiast w polach wirujących od 20 do 400Hz.

W polach przemiennych badania materiału mogą być realizowane w obwodach probierczych takich jak: rama Epsteina, próbka toroidalna, znormalizowana jak i nieznormalizowana, próbka beleczkowa, Single Sheet Tester, próbka otwarta.

Ponadto mogą być prowadzone badania właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich również na pojedynczych paskach blachy elektrotechnicznej w specjalnie do tego celu wykonanych magnetowodach, dla próbek o różnych wymiarach geometrycznych. W polach wirujących pomiar natężenia pola magnetycznego realizowany jest metodą bezpośrednią za pomocą płaskiej cewki. Istnieje możliwość podłączenia również takich czujników jak: cewka Rogowskiego i czujnik hallotronowy.

Ekspozycja wyników pomiaru w postaci tabelarycznej i graficznej:

- na ekranie monitora,
- za pomocą drukarki.

"R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

55-093 BOROWA,
ul. Jaśminowa 2
POLSKA,

e-mail: bajorek@rjmeasurement.com.pl

tel. 691 255 202

www.rjmeasurement.com.pl

str. 1 z 8



R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów
Komputerowych

1. WYPOSAŻENIE

W skład komputerowego systemu pomiarowego MAG-TD200 wchodzi:

- komputer AMD ATHLON XP 2 GHz, HDD 120GB, FDD 1.44MB, RAM 512 MB, 6*USB2.0, 2*RS232, GEFORCE 128MB,
- nagrywarka CDRW lub DVDRW,
- monitor kolorowy 17",
- drukarka laserowa,
- sieciowy filtr przeciwzakłóceń,
- kable łączące,
- blok układu sterowania i pomiaru sygnałów,
- zestaw mebli - zabudowa systemu,
- płyta instalacyjna CD ROM,
- instrukcja obsługi – szt. 2.

Blok układu sterowania i pomiaru sygnałów zawiera:

- układy pomiarowe,
- odpowiednie układy funkcjonalne - cyfrowe i analogowe,
- wzmacniacze o mocy dyssypacji ok. 700W,
- zasilacze.

**"R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I
SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH**

55-093 BOROWA,
ul. Jaśminowa 2
POLSKA,

e-mail: bajorek@rjmeasurement.com.pl

tel. 691 255 202

www.rjmeasurement.com.pl

str.2 z 8



R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów
Komputerowych

2. RODZAJ BADANEGO OBIEKTU

- Rama Epsteina 25 cm, 0,5 kg,
- Próbka Toroidalna,
- Jarzmo JM50 do pomiaru próbek beleczkowych,
- Single Sheet Tester,
- Jarzmo JM100,
- Jarzmo JM280,
- Próbka Otwarta,
- Jarzmo XY lub XY10.

"R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I
SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

55-093 BOROWA,
ul. Jaśminowa 2
POLSKA,

e-mail: bajorek@rjmeasurement.com.pl

tel. 691 255 202

www.rjmeasurement.com.pl

str.3 z 8



3. RODZAJ MIERZONYCH WIELKOŚCI MAGNETYCZNYCH

- szczytowa wartość natężenia pola magnetycznego Hm [A/m]
- skuteczna wartości natężenia pola magnetycznego Heff [A/m]
- wartość koercji Hc [A/m]
- szczytowa wartość magnetyzacji Jm [T]
- szczytowa wartość indukcji Bm [T]
- skuteczna wartość magnetyzacji J_{eff} [T]
- wartość remanencji J_r [T]
- stratność czynna P_s [W/kg]
- stratność pozorna S_s [VA/kg]
- rozdział strat na straty:
 - histerezy P_h [W/kg]
 - wiroprądowe P_w [W/kg]
- przenikalność początkowa dla aparatu Epsteina 25cm dla:
 - Hm = 0.4 A/m; f = 50 Hz μA_{pocz}
 - Hm = 1.6 A/m; f = 50 Hz
- względna przenikalność amplitudowa μA
- względna przenikalność różniczkowa μr
- pętle histerezy dla żądanej wartości:
 - magnetyzacji,
 - natężenia pola magnetycznego

z pełnym opisem parametrów
- zbiór pętli histerez dla różnych wartości magnetyzacji lub natężenia pola magnetycznego z pełnym opisem parametrów dla każdego punktu pomiarowego
- anizotropia magnetyzacji AJ [T]
- anizotropia stratności APs [%]
- rozkład w szereg Fouriera z pełnym opisem i grafika w postaci wykresu prążkowego dla każdego punktu pomiarowego przebiegu:

"R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH



- natężenia pola magnetycznego
 - magnetyzacji
 - stratności czynnej
 - stratności biernej
 - stratności pozornej
- z określeniem mocy deformacji
- przebiegi czasowe napięć i prądów z pełnym opisem parametrów, dla każdego punktu pomiarowego
 - przebiegi czasowe magnetyzacji i natężenia pola magnetycznego, z pełnym opisem parametrów, dla każdego punktu pomiarowego
 - współczynnik szczytu natężenia pola magnetycznego ks
 - współczynnik kształtu natężenia pola magnetycznego kk
 - masa próbki w trybie automatycznym
 - końcowe zestawienia wyników pomiarów.

W polach wirujących wszystkie parametry wyznaczane są dla obu kierunków jednocześnie.

Ponadto, w polach wirujących system MAG-TD200 pozwala wyznaczyć:

- stratność rotacyjną Pr [W/kg]
 - kat pomiędzy wektorem H i J PhaXY [°]
 - szczytowa wartość natężenia pola magnetycznego HmPeak [A/m]
 - szczytowa wartość magnetyzacji JmPeak [T]
 - pętle histerezy dla żądanej wartości magnetyzacji
 - $J_x = f(H_x)$
 - $J_y = f(H_y)$
 - $J_y = f(J_x)$
 - $H_y = f(H_x)$
 - $J_y = f(J_x)$ i $H_y = f(H_x)$ jednocześnie
- z pełnym opisem parametrów

"R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I
SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH



4. PARAMETRY POMIARU WIELKOŚCI MAGNETYCZNYCH

- zakres pomiarowy magnetyzacji J_m [T] (0,01÷2,5)
- zakres pomiarowy natężenia pola magnetycznego H_m dla:
 - aparatu Epsteina 25cm [A/m] (2÷15 500)
 - układu probierczego JM50 [A/m] (250÷7 500)
 - układu probierczego JM100 i JM280 [A/m] (2÷11 000)

W przypadku próbki toroidalnej maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego, przy danej liczbie zwojów magnesujących, uwarunkowana jest jej wymiarami geometrycznymi i dopuszczalną gęstością prądu w uzwojeniu magnesującym.

- zakres częstotliwości f_b wymuszanych pól
 - dla pól przemiennych [Hz] (3÷2 000)
 - dla pól rotacyjnych [Hz] (20÷400)
- minimalna zmiana częstotliwości Δf_b [Hz] 0,01
- dokładność nastawy częstotliwości
 - dokładność nastaw magnetyzacji J_m [%] < 0,1
 - dla pól przemiennych:
 - $0 < J_m \leq 0,5 \text{ T}$ [%] 0,5
 - $0,5 \text{ T} < J_m \leq 0,9 \text{ T}$ [%] 0,3
 - $0,9 \text{ T} < J_m < 2,5 \text{ T}$ [%] 0,1
 - dla pól wirujących:
 - $0 < J_m \leq 0,5 \text{ T}$ [%] 1,0
 - $0,5 \text{ T} < J_m \leq 0,9 \text{ T}$ [%] 0,5
 - $0,9 \text{ T} < J_m < 2,5 \text{ T}$ [%] 0,3
- dokładność odtworzenia sinusoidalnego przebiegu pochodnej magnetyzacji dla pomiarów wykonywanych po J_m
 - dla pól przemiennych:
 - $0 < J_m \leq 0,2 \text{ T}$ [%] 1,0
 - $0,2 \text{ T} < J_m \leq 0,5 \text{ T}$ [%] 0,5
 - $0,9 \text{ T} < J_m < 2,5 \text{ T}$ [%] 0,1

"R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH



R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów
Komputerowych

- dla pól wirujących $0 < J_m \leq 2,5 \text{ T}$ [%] 1,0
- dokładność nastaw natężenia pola magnetycznego H_m
 - dla pól przemiennych: $0 < H_m \leq 10 \text{ A/m}$ [%] 0,3
 - $0 < H_m \leq 50 \text{ A/m}$ [%] 1,0
 - $50 \text{ A/m} < H_m \leq 1000 \text{ A/m}$ [%] 0,5
 - $1000 \text{ A/m} < H_m$ [%] 0,4
- dokładność odtworzenia sinusoidalnego przebiegu pochodnej magnetyzacji dla pomiarów wykonywanych po H_m
 - dla pól przemiennych: $0 < H_m < 10 \text{ A/m}$ [%] 1,0
 - $10 \text{ A/m} < H_m \leq 90 \text{ A/m}$ [%] 0,5
 - $90 \text{ A/m} < H_m$ [%] 0,1
- liczba punktów pomiarowych [--] 1÷150

"R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I
SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

55-093 BOROWA,
ul. Jaśminowa 2
POLSKA,

e-mail: bajorek@rjmeasurement.com.pl

tel. 691 255 202

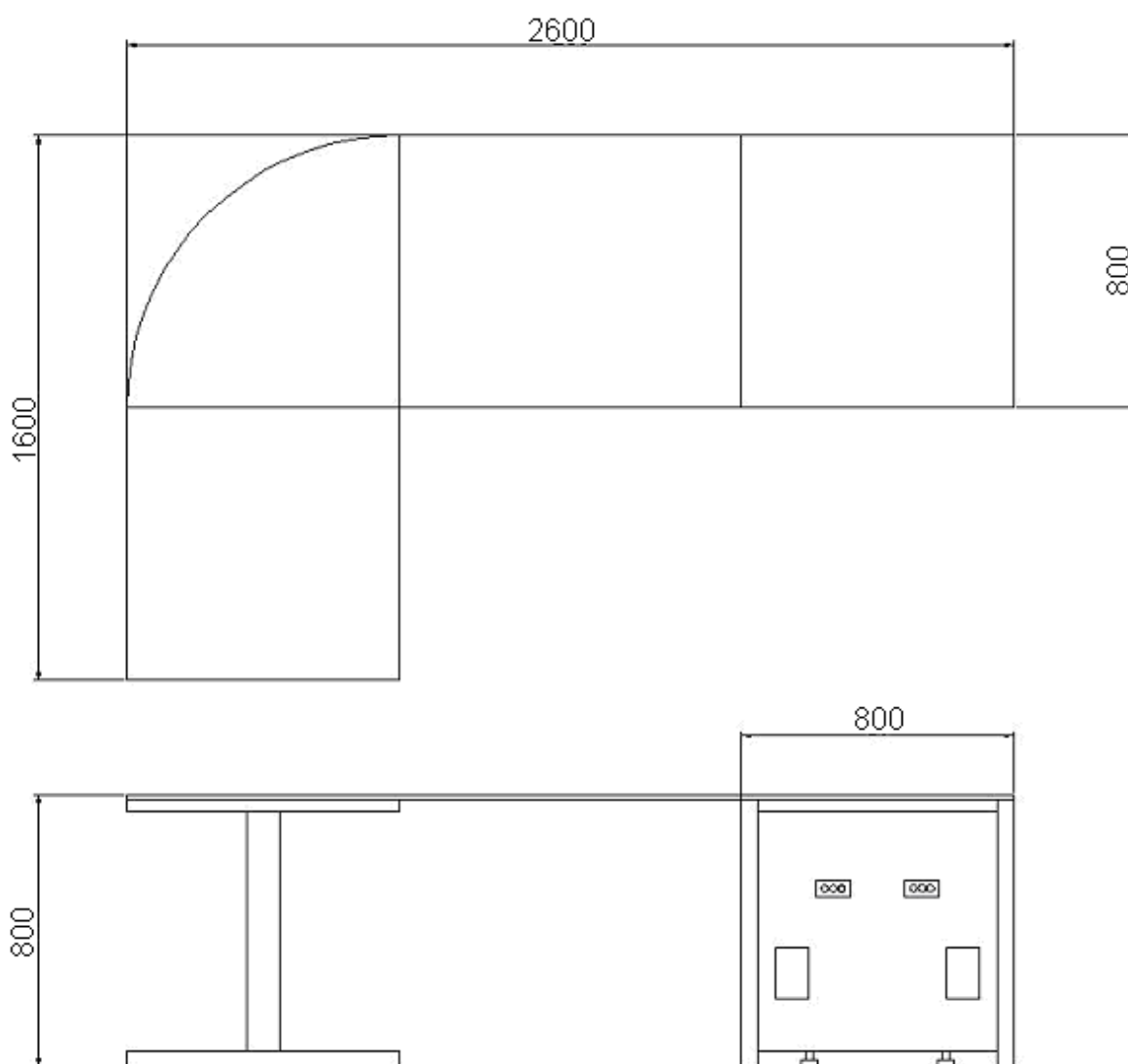
www.rjmeasurement.com.pl

str. 7 z 8

5. ZASILANIE

- Zasilanie trójfazowe 3*400V, +5%, -10%,
- Zasilanie jednofazowe 230V, +5%, -10%,
- Częstotliwość 50 Hz
- Moc maksymalna 2 kVA

6. WYMIARY



"R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH